

# JIS

## 識別カードの試験方法ー 第2部：磁気ストライプ付きカード

JIS X 6305-2 : 2020  
(ISO/IEC 10373-2 : 2015)  
(JSA)

令和2年12月21日 改正

認定産業標準作成機関 作成・審議

(日本規格協会 発行)

一般財団法人日本規格協会 情報分野産業標準作成委員会 構成表

	氏名	所属
(委員長)	渡 邊 創	国立研究開発法人産業技術総合研究所
(委員)	安 形 輝	亜細亜大学
	天 野 佑 基	総務省国際戦略局
	石 井 正 悟	独立行政法人情報処理推進機構
	伊 藤 雅 樹	株式会社日立製作所
	寺 田 真 敏	東京電機大学
	中 上 直 子	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
	仲 谷 文 雄	一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
	野々垣 典 男	一般社団法人日本情報システムユーザー協会
	福 田 昭 一	富士通株式会社

---

主 務 大 臣：経済産業大臣 制定：平成 15.2.20 改正：令和 2.12.21

担 当 部 署：経済産業省産業技術環境局 国際電気標準課

(〒100-8901 東京都千代田区霞が関 1-3-1)

官 報 掲 載 日：令和 2.12.21

認定産業標準作成機関：一般財団法人日本規格協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-13-12 三田 MT ビル)

素 案 作 成 者：一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会

(〒108-0073 東京都港区三田 3-4-10 リーラヒジリザカ)

審 議 委 員 会：情報分野産業標準作成委員会 (委員長 渡邊 創)

この規格についての意見又は質問は、上記認定産業標準作成機関又は素案作成者にご連絡ください。

なお、日本産業規格は、産業標準化法の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに見直しが行われ速やかに確認、改正又は廃止されます。

## 目 次

	ページ
序文	1
1 適用範囲	1
2 引用規格	1
3 用語及び定義	2
4 指定がない場合の試験環境及び条件	5
4.1 試験環境	5
4.2 事前調整	5
4.3 試験方法の選択	5
4.4 指定がない場合に適用される公差	5
4.5 総合的な測定不確定性	5
5 試験方法	6
5.1 磁気ストライプ領域の反り	6
5.2 磁気ストライプの盛上がり高さ及び断面形状	7
5.3 磁気ストライプの表面粗さ	11
5.4 磁気ストライプの耐磨耗性	11
5.5 振幅測定	13
5.6 磁束反転距離の変動	21
5.7 磁気ストライプとカードとの接着性	22
5.8 静的磁気特性	23
5.9 波形 $U_{i6}$	25
5.10 高保磁力、高密度記録の重ね書き	25
附属書 A (参考) 試験ヘッドの磨耗の影響及び耐磨耗性試験ヘッドの使用	27
参考文献	28
解 説	29

## まえがき

この規格は、産業標準化法第 16 条において準用する同法第 14 条第 1 項の規定に基づき、認定産業標準作成機関である一般財団法人日本規格協会（JSA）から、産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり、経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって、**JIS X 6305-2:2010** は改正され、この規格に置き換えられた。

この規格は、著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が、特許権、出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣は、このような特許権、出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認について、責任はもたない。

# 識別カードの試験方法— 第 2 部：磁気ストライプ付きカード

## Identification cards—Test methods—Part 2: Cards with magnetic stripes

### 序文

この規格は、2015 年に第 3 版として発行された ISO/IEC 10373-2 を基に、技術的内容及び構成を変更することなく作成した日本産業規格である。

なお、この規格で点線の下線を施してある参考事項は、対応国際規格にはない事項である。

### 1 適用範囲

この規格を含む JIS X 6305 (規格群) は、JIS X 6301 に基づく識別カードの特性評価試験方法を規定しており、各試験方法は、一つ以上の基本規格と相互に参照される。基本規格とは、例えば、JIS X 6301、ID カードを使ったアプリケーションで利用する情報記憶技術を規定する規格である。

この規格は、JIS X 6301 に基づく識別カード (以下、“ID カード” 又は単に“カード” という。) の磁気ストライプ技術に特有な試験方法について規定する。

**注記 1** 適合基準はこの規格の中にはなく、基本規格の中に規定している。

**注記 2** この規格で規定する試験方法は、項目別に実施される。1 枚の供試カードを用いて、全ての項目を順番に試験することを意味していない。

**注記 3** この規格の基本規格の一つである JIS X 6302-2 では、国際規格では規定されていないおもて面磁気ストライプ付き識別カードを**附属書 JA** として規定している。この規格の一部は、JIS X 6302-2 の**附属書 JA** に規定する磁気ストライプ付き識別カードの試験方法として参照可能である。

**注記 4** この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を、次に示す。

ISO/IEC 10373-2:2015, Identification cards—Test methods—Part 2: Cards with magnetic stripes (IDT)

なお、対応の程度を表す記号“IDT”は、ISO/IEC Guide 21-1 に基づき、“一致している”ことを示す。

### 2 引用規格

次に掲げる引用規格は、この規格に引用されることによって、その一部又は全部がこの規格の要求事項を構成している。これらの引用規格のうち、西暦年を付記してあるものは、記載の年の版を適用し、その後の改正版 (追補を含む。) は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は、その最新版 (追補を含む。) を適用する。